MASTER DISK FORMING DEVICE

Publication number: JP8185643 Publication date: 1996-07-16

Inventor: TAKANO .I

TAKANO JUNZO; YAMAGUCHI YOSHIHIRO; NAITO

HIROSHI; MITSUI MICHIO

Applicant: SONY CORP

Classification:

- international: G11B7/26; G11B7/26; (IPC1-7): G11B7/26

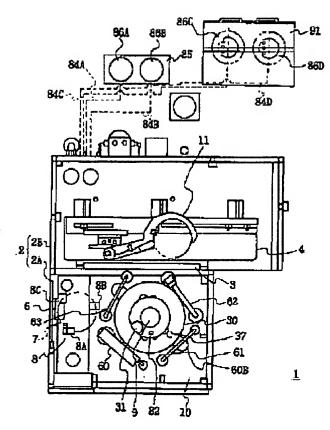
- European:

Application number: JP19940341185 19941230 Priority number(s): JP19940341185 19941230

Report a data error here

Abstract of JP8185643

PURPOSE: To efficiently treat a waste liquid and to efficiently produce a master disk by executing a development processing stage and a pretreating stage within the same splashing preventive means. CONSTITUTION: A series of processing are executed within one chamber 30 of this device 1. Liquid chemicals, such as alkaline developers, acidic surfactants and catalysts, and washing water are discharged via one discharge hole 37 formed at the bottom in this chamber 30 into a drain neutralizing tank outside a casing 2. The alkaline developers at the time of the development processing stage are neutralized by sticking to the inside wall of the chamber and the contamination of the inside walls of the chamber 30 is prevented when the acidic catalysts stick to the inside walls of the chamber 30 at the time of the NED preprocessing stage where the development processing and the WED pre-processing are executed within the one chamber 30.



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

(19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平8-185643

(43)公開日 平成8年(1996)7月16日

(51) Int.Cl.6

識別記号

庁内整理番号

FΙ

技術表示箇所

G 1 1 B 7/26

501

7215-5D

審査請求 未請求 請求項の数3 FD (全 20 頁)

(21)	出願	野号
------	----	----

特願平6-341185

(22)出願日

平成6年(1994)12月30日

(71)出願人 000002185

ソニー株式会社

東京都品川区北品川6丁目7番35号

(72)発明者 高野 純三

東京都品川区北品川6丁目7番35号ソニー

株式会社内

(72)発明者 山口 喜弘

東京都品川区北品川6丁目7番35号ソニー

株式会社内

(72)発明者 内藤 弘

東京都品川区北品川6丁目7番35号ソニー

株式会社内

(74)代理人 弁理士 田辺 恵基

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 デイスク原盤作成装置

(57)【要約】

【目的】効率良くかつ歩留り良くデイスク原盤を作成し 得るようにすることのできるデイスク原盤作成装置を目 的とする。

【構成】デイスク成形時に金型となるデイスク原盤の作 成工程のうち、レジストマスタ板に対する現像処理工程 と、レジストマスタ板の表面を導体化させるための前処 理工程とを同じ飛散防止手段の内部において行うように したことにより、現像処理工程時に生じる現像液でなる 強アルカリ性の廃液と、レジストマスタ板の表面を導体 化させるための前処理工程時に生じる薬液でなる酸性の 廃液とを中和させることができる。従つて現像処理工程 時及び上述の前処理工程時に生じる廃液を効率良く処理 できると共に、飛散防止手段の内壁面の汚染を防止で き、かくして効率良くかつ歩留り良くデイスク原盤を作 成し得るようにすることのできるデイスク原盤作成装置 を実現できる。

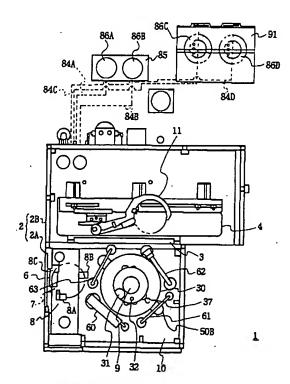


図1 実施例によるデイスク原盤作成装置の全体構成

1

【特許請求の範囲】

【請求項1】所定材からなる基板の一面上にホトレジストを塗布することによりレジスト層が形成され、かつ上記レジスト層が記録信号に基づいて露光されてなるレジストマスタ板を、所定状態に固定保持すると共にその軸を中心として回転させる回転手段と、

上記レジスト層を現像するための現像液及び上記レジトスマスタ板の表面を導体化させるための前処理に用いる所定の薬液を、上記回転手段に固定保持された上記レジストマスタ板上に所定のタイミングで供給する現像液及 10 び薬液供給手段と、

上記回転手段を取り囲むように設けられ、回転する上記レジストマスタ板から飛び散る上記現像液及び又は上記薬液を内壁面において受けることにより上記現像液及び又は上記薬液が外部に飛散するのを防止する飛散防止手段とを具え、デイスク成形時に金型となるデイスク原盤の作成工程のうち、上記レジストマスタ板に対する現像処理工程と、上記レジストマスタ板の上記表面を導体化させるための上記前処理工程とを同じ上記飛散防止手段の内部において行うことを特徴とするデイスク原盤作成 20 装置。

【請求項2】上記現像液及び上記薬液供給手段は、上記デイスクマスタ板を水洗するための水洗水を上記レジストマスタ板上に所定のタイミングで供給する水洗水供給手段を具えることを特徴とする請求項1に記載のデイスク原盤作成装置。

【請求項3】上記回転手段は、

上記レジストマスタ板を載せるための1つのターンテーブルと、

上記ターンテーブルに回転力を与える駆動手段と、

上記ターンテーブル上に載せられた上記レジストマスタ 板を当該ターンテーブル上に吸着する吸着手段とでな り、

上記飛散防止手段は、

先端部に上記レジストマスタ板を挿脱するための開口が 設けられたドーム状の1つのチャンバでなることを特徴 とする請求項1に記載のデイスク原盤作成装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【目次】以下の順序で本発明を説明する。

産業上の利用分野

従来の技術

発明が解決しようとする課題

課題を解決するための手段(図1~図17)

作用(図1~図17)

実施例

- (1) デイスク原盤作成装置の全体構成(図1~図1 0)
- (2) 現像処理手順及びNED前処理手順(図1~図1 7)

- (3) 実施例の動作(図1~図19)
- (4) 実施例の効果 (図1~図19)
- (5) 他の実施例(図1~図19)

発明の効果

[0002]

【産業上の利用分野】本発明はデイスク原盤作成装置に関し、例えば光デイスク成形時の金型となる光デイスク原盤(いわゆるスタンパ)の作成工程のうち、現像処理工程と、無電解ニツケルめつき(NED: non Electro deposition)処理等の導電化処理の前処理工程とを1つの装置で行い得るようにしたものである。

2

[0003]

【従来の技術】従来この種のスタンパは、通常、以下の手順により作成されている。まず一面が極めて平滑に研磨されたガラス板の当該一面上にレジストを塗布することによりレジスト層を形成(以下、このようなガラス板をレジストマスターガラス板と呼ぶ)し、次いで当該レジスト層を記録信号に基づいて露光し、現像することによりガラス板の一面上に記録信号に応じた凹凸パターンを残存するレジスト層で形成する。続いてこのレジストマスターガラス板の凹凸パターンの表面上にNED処理を施すことにより二ツケル等でなる導電化膜層を形成し、この後電鋳により導電化膜層上に二ツケル等でなる金属層を形成する。

【0004】さらにこの後金属層及び導電化膜層を一体にガラス板から剥離し、これを所定形状に打ち抜く。これにより記録信号に応じた凹凸パターンが一面に形成されてなるスタンパを得ることができる。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】ところでこのようなスタンパの作成工程のうち現像処理工程は、実際上、露光処理工程(カツテイング処理工程)が終了したレジストマスターガラス板のレジスト層に、例えばメタケイ酸ナトリウム等のアルカリ水溶液でなる現像液を供給し、当該レジスト層の露光された部分を当該現像液によつて溶解することにより行われる。

【0006】またNED処理工程は、現像処理工程が終了したレジストマスターガラス板をニツケル無電解溶液中に浸漬し、ニツケルをレジストマスターガラス板のレジスト層表面に析出させることにより行われる。この場合現像処理工程終了後のレジストマスターガラス板に対してNED処理を施すに際しては、ニツケルの析出を促進させるために所定の前処理(以下、これをNED前処理と呼ぶ)を施す必要がある。このため従来ではNED前処理として、現像処理工程終了後のレジストマスターガラス板に対して、凹凸パターンの表面上にレジスト層のぬれ性を向上させるためのサーフアクタント等でなる表面活性剤を塗布し、次いで塩化第1パラジウム及び塩化第1錫がコロイド状に配合されてなる酸性の薬液(例50 えばキヤタリスト)を塗布した後、メツキ析出を促進す

るための硝酸ナトリウム、ブドウ糖、塩化ナトリウム及 び硫酸等からなる酸性のアクセレレータ等の薬液を塗布 していた。

【0007】ここで、従来では現像処理工程及びこのよ うなNED前処理工程がそれぞれ別々の装置によつて行 われており、また各装置からの排液の中和処理もそれぞ れ別々の中和槽を用いて行われている。さらに従来のN ED前処理工程を行う装置では、加工対象のレジストマ スターガラス板をターンテーブル上に載せて回転させな がら、当該レジストマスターガラス板の上面(レジスト 10 面側)上に所定のタイミングでアクセレレータ、キヤタ リスト及びアクセレレータ等を順次供給することにより これらの薬液のレジストマスターガラス板上面への塗布 を行つている。

【0008】しかしながらこのような構成の装置では、 回転するレジストマスターガラス板から飛び散つた薬液 がターンテーブル周囲を取り囲むチャンパの内壁面に付 着することにより、これら薬液(特にキヤタリスト)に よつてチャンパ内壁面が汚染され易く、この結果NED 前処理中のレジストマスターガラス板から飛び散つた薬 20 液がチャンパの内壁面に当たつて跳ね返り、レジストマ スターガラス板の表面に付着することにより当該レジス トマスターガラス板のしみ不良や、ピンホール状のメツ キ不析出不良が発生するなど、歩留りが悪くなる問題が あつた。

【0009】従つてこのような状況を考慮して、例えば 現像処理工程及びNED前処理工程を1つの装置で行い 得るようにすることができれば、現像処理工程で排出さ れるアルカリ性の現像液と、NED前処理工程で排出さ れる酸性のキヤタリストとが互いに中和するため、各薬 30 液の中和処理をほぼ省略でき、かつ装置の一体化により スタンパの作成工程にかかるコストを低減や、現像処理 装置からNED前処理装置への搬送時間の省略など、ス タンパ作成工程の効率化を図れるものと考えられる。ま たこのように現像処理工程及びNED前処理工程を1つ の装置で行い得るようにすることができれば、現像液と キヤタリストとが互いに中和することによりチャンパ内 壁の汚染が防止でき、かくして歩留り良くスタンパを作 成し得るようにすることができるものと考えられる。

【0010】本発明は以上の点を考慮してなされたもの 40 で、効率良くかつ歩留り良くデイスク原盤を作成し得る ようにすることのできるデイスク原盤作成装置を提案し ようとするものである。

[0011]

【課題を解決するための手段】かかる課題を解決するた め本発明においては、所定材からなる基板の一面上にホ トレジストを塗布することによりレジスト層が形成さ れ、かつレジスト層が記録信号に基づいて露光されてな るレジストマスタ板 (7) を、所定状態に固定保持する

0)と、レジスト層を現像するための現像液及びレジト スマスタ板 (7) の表面を導体化させるための前処理に 用いる所定の薬液を、回転駆動手段(9、20)に固定 保持されたレジストマスタ板(7)上に所定のタイミン グで供給する現像液及び薬液供給手段(60~63) と、回転手段を取り囲むように設けられ、回転するレジ ストマスタ板(7)から飛び散る現像液及び又は薬液を 内壁面において受けることにより現像液及び又は薬液が 外部に飛散するのを防止する飛散防止手段(30)とを 設け、デイスク成形時に金型となるデイスク原盤の作成 工程のうち、レジストマスタ板(7)に対する現像処理 工程(RT1)と、レジストマスタ板(7)の表面を導 体化させるための前処理工程 (RT2) とを同じ飛散防 止手段(30)の内部において行うようにした。

【0012】また本発明においては、現像液及び薬液供 給手段(60~63)は、デイスクマスタ板(7)を水 洗するための水洗水をレジストマスタ板 (7) 上に所定 のタイミングで供給する水洗水供給手段(60~63) を設けるようにした。

【0013】さらに本発明においては、回転手段(9、 20) は、レジストマスタ板(7) を載せるための1つ のターンテーブル (9) と、ターンテーブル (9) に回 転力を与える駆動手段(20)と、ターンテーブル (9) 上に載せられたレジストマスタ板(7) を当該タ ーンテープル(9)上に吸着する吸着手段とでなり、飛 散防止手段(30)は、先端部にレジストマスタ板 (7)を挿脱するための開口が設けられたドーム状の1 つのチャンパでなるようにした。

[0014]

【作用】デイスク成形時に金型となるデイスク原盤の作 成工程のうち、レジストマスタ板に対する現像処理工程 (RT1)と、レジストマスタ板(7)の表面を導体化 させるための前処理工程(RT2)とを同じ飛散防止手 段(30)の内部において行うようにしたことにより、 現像処理工程(RT1)時に生じる現像液でなる強アル カリ性の廃液と、レジストマスタ板 (7) の表面を導体 化させるための前処理工程時に生じる薬液でなる酸性の 廃液とが中和する。

【0015】従つて現像処理工程(RT1)時に生じる 廃液と、レジストマスタ板(7)の表面を導体化させる ための前処理工程 (RT2) 時に生じる廃液とをそれぞ れ別々に中和処理するような従来の装置に比べて格段的 に排液処理を容易に行うことができる。また飛散防止手 段(30)の内壁面に付着した薬液も現像液によつて中 和されるため、薬液による飛散防止手段(30)の内壁 面の汚染を防止でき、かくして例えば処理中のレジスト マスタ板(7)から飛び散つた薬液が汚染された飛散防 止手段(30)の内壁面において跳ね返り、レジストマ スタ板(7)に付着することにより発生するしみ不良 と共にその軸を中心として回転させる回転手段(9、2 50 や、ピンホール状のメツキ不析出不良が発生するなどを

未然に防止できる分、効率良くかつ歩留り良くデイスク 原盤を作成し得るようにすることのできるデイスク原盤 作成装置を実現することができる。

[0016]

【実施例】以下図面について、本発明の一実施例を詳述 する。

【0017】(1)デイスク原盤作成装置の全体構成図1~図9(D)において、1は全体としてデイスク原盤作成装置を示し、供給される加工対象のレジストマスターガラス板に対して現像処理及びNED前処理を行い 10得るようになされている。すなわちこのデイスク原盤作成装置1においては、図1において明らかなように、第1の枠体2Aと、当該第1の枠体2Aとシヤツタ3を介して連通する第2の枠体2Bとで構成される独立して密閉された筐体2を有し、当該筐体2の上面には筐体2内部のクリーン度を保ち得るようにヘパフイルタ5(図7)が設けられている。

【0018】この筐体2の第1の枠体2A側の一側壁には、図2及び図3からも明らかなように、開閉自在にシャツタ6が設けられており、第1の枠体2Aの内部には、前段の装置から送られてきた加工対象のレジストマスターガラス板7を載上するための3本の柱状部材8A、8B、8Cで構成されるガラスステージ8と、ターンテーブル9とが仕切り板10上に設けられている。また図1からも明らかなように、第2の枠体2Bの内部にはガラスステージ8及びターンテーブル9間と、ターンテーブル9及び第2の枠体2B内に設けられたベルトコンペア状のガラス板搬送部4間とにおいてレジストマスターガラス板7を搬送するトランスフアユニツト11が配設されている。30

【0019】かくしてこのデイスク原盤作成装置1では、シヤツタ6の開閉によつて第1の枠体2A内部の雰囲気をほぼ変化させずに外部からレジストマスターガラス板7をガラスステージ8上に取り込み得ると共に、当該ガラスステージ8上に載上されたレジストマスターガラス板7を、シヤツタ3の開閉及びトランスフアユニツト11によつて第1の枠体2A内部の雰囲気をほぼ変化させずにターンテーブル9上に搬送し、かつターンテーブル9上のレジストマスターガラス板7をシヤツタ3の開閉及びトランスフアユニツト11によつて第1の枠体402A内部の雰囲気をほぼ変化させずにガラス板搬送部4上に搬送し得るようになされている。

【0020】ターンテーブル9においては、仕切り板10の下方に配設されたターンテーブル駆動モータ20(図3及び図4)の回転出力に基づいて回転駆動し得るようになされており、その外周部には円周上にパキユーム用溝(図示せず)と、パキユーム破壊用溝(図示せず)との2本の溝が形成されている。

【0021】この場合パキユーム用溝は、仕切り板10 ンクから図7の中和用管42を介して中和薬液が供給さ 下側に配設された図示しない管と、図6のように筐体2 50 れる。かくしてこのディスク原盤作成装置1では、排液

の背面側に設けられたパキユームロ21と、図7に示すように筐体2の外部に配設されたパキユーム用管22とをそれぞれ順次介して図示しない負圧源と接続されていると共に、パキユーム破壊用溝は、仕切り板10の下側に配設された図示しない管と、筐体2の外部に配設された高圧エアーロ23(図6)と、筐体2の外部に配設された高圧エアー用管24(図7)とを順次介して図示しない高圧エアー源と接続されている。かくしてこのデイスク原盤作成装置1においては、負圧源からターンテーブル9のパキユーム用溝に与えられる負圧に基づいて加工対象のレジストマスターガラス板7をターンテーブル9のパキユームの壊用溝に与えられる高圧エアーによつて解除し得るようになされている。

【0022】また仕切り板10上には、特に図4において明らかなように、ターンテーブル9を取り囲むように塩化ビニール樹脂材等で形成された大小それぞれ異なる大きさの3重構造のチヤンパカバー30A、30B、30Cからなるチヤンパ30が配設されており、かくしてターンテーブル9上に載せられたレジストマスターガラス板7から当該レジストマスターガラス板7に対して所定の加工処理を施す際に供給した薬液や純水等がチヤンパ30の内側以外の領域に飛び散るのを防止し得るようになされている。

【0023】このチヤンパ30の内側底部には、特に図2からも明らかなように、純水ノズル32がその先端を斜め上方向に向けて配設されており、当該純水ノズル32は、仕切り板10下側に配設された図5に示す純水パ30ルプ33A、33B及び純水供給用バルブ34と、図6のように筐体2の背面に設けられた純水取込み口35と、図7のように筐体2の外部に配設された純水供給管36とをそれぞれ順次介して図示しない純水源と接続されている。かくしてこのデイスク原盤作成装置1では、ターンテーブル9に吸着固定されたレジストマスターガラス板7に対して、純水源から供給される純水を純水ノズル32からその裏面の内側から外側に向けて噴出するようにして当該レジストマスタがガラス板7の裏面を水洗し得るようになされている。

【0024】またチャンパ30の内側底部には図2のように排液用孔37が設けられており、チャンパ30の内部に排出された薬液や洗浄後の排水を、当該排液用孔37から仕切り板10の下側に配管された排液用管37(図4)と、図6に示す筐体2の背面に設けられた排液用口39と、図7のように筐体2の外側に配管された排水管40とをそれぞれ順次介して筐体2とは別体に設けられた図8に示す排水中和槽41内に排出し得るようになされている。この場合排水管40には、図示しないタンクから図7の中和用管42を介して中和薬液が供給される。

を排水中和槽41内において中和させた後、続く廃水処 理槽へ排出し得るようになされている。

【0025】さらにチヤンパ30(図2)の周側壁には 排気孔(図示せず)が2箇所設けられており、チャンパ 30内部に発生した薬液等の霧をこれら各排気孔から排 気用管50A、50Bと、仕切り板10の下側に設けら れた図4の排気用管51と、筐体2の背面に設けられた 排気口52 (図4及び図6) と、筐体2の外部に配管さ れた図7の排気ダスト53とをそれぞれ順次介して筐体 2の外部に排出し得るようになされている。一方特に図 10 2からも明らかなように、チャンパ30の外側には現像 アーム60、サーフアクタントアーム61、キヤタリス トアーム62、アクセレレーターアーム63が配設され ており、現像アーム60は図3に示すエアーシリンダ7 0及びエアーシリンダ71からそれぞれ与えられる動力 に基づいて上下動作及び旋回動作を行い、サーフアクタ ントアーム61はエアーシリンダ72及びエアーシリン ダ73からそれぞれ与えられる動力に基づいて上下動作 及び旋回動作を行い、かつアクセレレータアーム63 (図2) はエアーシリンダ74及び図示しないエアーシ 20 リンダからそれぞれ与えられる動力に基づいて上下動作 及び旋回動作を行い得るようになされている。

【0026】またキヤタリストアーム62は、エアーシ リンダ75から与えられる動力に基づいて上下動作を行 うと共に、図示しないモータの回転出力に基づいてシヤ フトを動作させて旋回し得るようになされている。この 場合図9(A)に示すように、現像アーム60の先端部 を構成するノズル管80は2重構造となつており、内側 ノズル管80Aは仕切り板10(図1~図3)下側に配 設された薬液パルプ81A(図5)と、筐体2の背面に 30 設けられた現像液取込み口82A(図6)と、筐体2の 外部に配設された図1に示す現像液供給管84Aとを順 次介して第1のキヤスタ85内の現像液タンク86Aと 接続されている。

【0027】また外側ノズル管80B(図9(A)) は、仕切り板10の下側に配設された純水パルプ33B (図5)を介して純水供給パルプ34に接続されている と共に、継手117C、流量計118、継手117B、 117Aを順次介して図6に示す純水取込み口35と接 続されている。これにより現像アーム60は、現像液タ 40 ンク86A(図1)から供給される現像液を内周側ノズ ル管80Aから吐出し得る一方、純水源から継手117 A~117C(図5)経由と純水パルプ33B経由とで 供給される純水を内周側ノズル管80A及び外周側ノズ ル管80Bの間から吐出し得るようになされている。

【0028】またサーフアクタントアーム61(図1及 び図2)は、図9(D)に示すようなノズル管で構成さ れ、仕切り板10下側に配設された切替えパルプ90A (図5) と、薬液パルプ81B(図5)と、筐体2の背 面に設けられたサーフアクタント取込み口82B(図 50 れていると共に、チャンパ30の内側底部には特に図2

6)と、筐体2の外部に配設されたサーフアクタント供 給管84B(図1)とを順次介して図1に示す第1のキ ヤスタ85内のサーフアントタンク86Bと接続され、 かつ切替えパルプ90A(図5)と、純水パルプ33C とを順次介して純水供給パルプ34とも接続されてい る。これによりサーフアクタントアーム61は、切替え パルプ90Aの切替え動作に応じてサーフアクタント又 は純水を先端から吐出し得るようになされている。

8

【0029】同様にしてアクセレレータアーム63は、 図9 (B) に示すようなノズル管で構成され、仕切り板 10下側に配設された切替えパルプ90B(図5)と、 薬液パルプ81C(図5)と、筐体2の背面に設けられ たアクセレレータ取込み口82C(図6)と、筐体2の 外部に配設されたアクセレレータ供給管84C (図1) とを順次介して第2のキヤスタ91内のアクセレレータ タンク86Cと接続され、かつ切替えパルプ90Bと、 純水パルプ33D(図5)と、純水パルプ33Aと、純 水パルプ33Bとを順次介して純水供給パルプ34にも 接続されている。これによりアクセレレーターアーム6 3 (図2) は、切替えパルプ90B(図5)の切替え動 作に応じてアクセレレータ又は純水を先端から吐出し得 るようになされている。

【0030】さらにキヤタリストアーム62は、特に図 2において明らかなように、アーム付け根部の立ち上が り部分から2本の配管がアームに束ねられた構造となつ ており、図9 (C) に示すように、ノズルも2本(以 下、これらをそれぞれ純水ノズル92及びキヤタリスト ノズル93と呼ぶ)設けられている。この場合キヤタリ ストノズル93は、仕切り板10下側に配設された薬液 パルプ81D(図5)と、筐体2の背面に設けられたキ ヤタリスト取込み口82D(図6)と、筐体2の外部に 配設されたキヤタリスト供給管84D(図1)とを順次 介して第2のキヤスタ91内部に配設されたキヤタリス トタンク86Dと接続されていると共に、純水ノズル9 3 (図9 (C)) は、純水パルプ33E (図5) 及び純 水パルプ33D、33C、33A、33B (図5) を順 次介して純水供給パルプ34(図5)と接続されてい る。従つてキヤタリストアーム62(図1及び図2)に おいては、キヤタリストタンク86Dから供給されるキ ヤタリストをキヤタリストノズル93(図9(C))の 先端から吐出し得る一方、純水源から供給される純水を 純水ノズル92の先端から吐出し得るようになされてい る。

【0031】さらにこのデイスク原盤作成装置1の場 合、駆動電力を電源ケーブル100(図7)を介して第 1の枠体2A内部のメインプレーカ101(図7)に入 力するようになされている。さらにこの実施例のデイス ク原盤作成装置1の場合、現像アーム60には図10に 示すようなモニタ用レーザ光発射部110が取り付けら

に示すようにフオトデイテクタ31が配設されており、 モニタ用レーザ光発射部110から発射され、ターンテーブル9上のレジストマスターガラス板7を介してフオトデイテクタ31に入射するレーザ光に基づいてレジストマスターガラス板7の現像状況をモニタし得るようになされている。

【0032】この場合モニタ用レーザ光発射部110においては、現像アーム60に取り付けられたレーザ源固定板111にレーザ源固定ユニット112を介して半導体レーザ113と鏡筒114とが一体に固定されること 10により形成され、鏡筒114の上部にはNDフイルタ115が配設されている。また鏡筒114内部には、第2の枠体2Bの背面に設けられたN2取込み口116(図6)と、筐体2内部に配管された図示しない管とを順次介してN2ガスが供給されるようになされており、かくして当該鏡筒114内部に供給されたN2ガスによつてターンテーブル9上のレジストマスターガラス板7上面のうち、モニタする部分の波立ちを押さえ得るようになされている。

【0033】(2)現像処理手順及びNED前処理手順 ここで実際上このデイスク原盤作成装置1の場合、前段 のラインから供給され、ガラスステージ8 (図1~図 3) 上に載上された加工対象のレジストマスターガラス 板7に対する現像処理及びNED前処理を図11及び図 12に示す現像処理手順RT1及び図12~図17に示 すNED前処理手順RT2に従つて行うようになされて いる。すなわちこのデイスク原盤作成装置1の場合、前 段の装置から筐体2内部のガラスステージ8上に加工対 象のレジストマスターガラス板9が供給されると、現像 処理手順RT1を開始し(ステップSP1)、まず筐体 30 2のシャツタ3 (図1及び図2) が開き (ステップSP 2)、続いてトランスフアユニツト11(図1及び図 2) が駆動してガラスステージ8上のレジストマスター ガラス板7をチヤンパ30内のターンテーブル9上にま で搬送する(ステップSP3)。

【0034】続いてこのレジストマスターガラス板7をターンテーブル9のパキユーム溝から与えられる負圧によつて当該ターンテーブル9上に吸着固定し(ステツプSP4)、この後トランスフアユニツト11が退避して元の位置に戻つた後(ステツプSP5)、筐体2ののシ 40ヤツタ3を閉じる(ステツプSP6)。次いでターンテーブル駆動モータ20(図3及び図4)が駆動してターンテーブル7を回転させ始め(ステツプSP7)、この後現像アーム60(図2)用のエアーシリンダ70、71(図3)がそれぞれ所定のタイミングで駆動することにより、現像アーム60を上昇させ、旋回させ、下降させるようにしてノズル80(図9(A))の先端をターンテーブル9上のレジストマスターガラス板7の中心部にまで移動させる(ステツプSP8)。

【0035】続いて現像アーム60用の純水バルブ33 50 1 (図1及び図2) 用のエアーシリンダ72、73 (図

10

B(図5)とバルブ117C(図5)とが開くことにより、当該外周側ノズル80B(図9(A))から純水を吐出するようにしてレジストマスターガラス板7の上面上に純水を供給する(ステツプSP9)と共に、チヤンパ30用の純水バルブ33A(図5)が開くことによりチャンパ30内部の純水ノズル32(図1及び図2)から純水をレジストマスターガラス板7の裏面に噴出するようにしてレジストマスターガラス板7の水洗を開始する(ステツプSP10)。このとき現像アーム60に取り付けられたモニタ用レーザ光発射部110(図10)が駆動する(ステツプSP11)と共に、この後所定時間が経過すると純水バルブ33B(図5)とバルブ117C(図5)とが閉じて現像アーム60の外周側ノズル管80B(図9(A))に対する純水の供給を停止することにより水洗を終了する(ステツプSP12)。

【0036】続いて薬液バルブ81A(図5)が開いて 現像アーム60の内周側ノズル管80A(図9(A)) からレジストマスターガラス板7上に現像液を吐出する ことによりレジストマスターガラス板7の現像を開始す 20 ると共に(ステツブSP13)、この後チヤンバ30(図2)内のフオトデイテクタ31(図2)が駆動して 現像状態のモニタを開始する(ステツプSP14)。この後モニタによる現像測定値が予めプログラムされた設 定値に到達すると(ステツプSP15)、薬液パルプ81A(図5)が閉じて現像アーム60の内周側ノズル管80A(図9)に対する現像液の供給を停止することに より現像を終了する(ステツプSP16)。

【0037】続いて純水バルプ33B(図5)が開いて 現像アーム60の外周側ノズル管80B(図9(A)) に対する純水の供給を開始することにより当該外周側ノ ズル管80Bから純水を吐出させてレジストマスターガ ラス板?に対する水洗を開始し(ステツプSP17)、 この後所定時間が経過すると、純水バルブ33B(図 5)が閉じて現像アーム60の外周側ノズル管80B (図9(A)) に対する純水の供給を停止することによ り水洗を終了する(ステツプSP18)。さらにこの後 現像アーム60に取り付けられたモニタ用レーザ光発射 部110 (図10) の半導体レーザ113 (図10) が レーザ光の発射を停止することによりモニタを終了し (ステップSP19)、この後現像アーム60用のエア ーシリンダ70、71 (図3) がそれぞれ所定のタイミ ングで駆動することにより、現像アーム60が上昇し、 旋回し、下降するようにして元の原点位置に戻る(ステ ツプSP20)。

【0038】かくしてデイスク原盤作成装置1は、この現像処理手順RT1を終了し、この後続くNED処理手順RT2に進む(ステツプSP21)。デイスク原盤作成装置1は、続くNED処理手順RT2を開始すると(ステツプSP30)、まずサーフアクタントアーム6

3)をそれぞれ所定のタイミングで駆動することにより、サーフアクタントアーム61を上昇させ、旋回させ、下降させるようにしてその先端をターンテーブル9上に吸着固定されたレジストマスターガラス板7の外周部上方にまで移動させる(ステツプSP31)。続いて純水バルブ33C(図5)が開き、切替えバルブ90A(図5)が純水側を選択することにより当該サーフアクタントアーム61の先端からレジストマスターガラス板7上面上に純水を吐出させる(ステツプSP32)。これによりこのレジストマスターガラス板7に対する水洗10を開始する(ステツプSP32)。

【0039】次いでエアーシリンダ73(図3)が駆動することによりサーフアクタントアーム61をレジストマスターガラス板7の外周部から中心部へ向けて移動さる。(ステップSP33)。この後所定時間が経過してサーフアクタントアーム61がレジストマスターガラス 板7の中心部にまで移動すると、純水バルブ33C(図5)が閉じてサーフアクタントアーム61に対する純水の供給を停止することにより水洗を完了する(ステップSP34)。続いて薬液パルブ81B(図5)が開き、かつ切替えパルブ90Aが薬液側を選択することにより当該サーフアクタントアーム61先端からサーフアクタントをレジストマスターガラス板7上面上に吐出させる。かくしてスピンコート法によつてレジストマスターガラス板7上面にサーフアクタントを塗布する(ステップSP35)。

【0040】この後所定時間が経過すると、薬液パルプ

81B(図5)が閉じてサーフアクタントアーム61に

対するサーフアンクタントの供給を停止することによ り、レジストマスターガラス板7に対するサーフアクタ 30 ントの塗布を終了する(ステツプSP36)。続いて純 水バルプ33Cが開き、切替えバルプ90Aが純水側を 選択することにより当該サーフアクタントアーム61の 先端から純水を吐出する(ステップSP37)と共に、 エアーシリンダ73(図3)が駆動してサーフアクタン トアーム61をレジストマスターガラス板7の中心部か ら外周部へ移動させることにより当該レジストマスター ガラス板7に対する水洗を行う(ステツプSP38)。 【0041】この後サーフアクタントアーム61がレジ ストマスターガラス板7の外周部に達すると、純水パル 40 プ33Cが閉じてレジストマスターガラス板7の水洗を 完了する(ステップSP39)と共に、サーフアクタン トアーム61用のエアーシリンダ72、73 (図3) が それぞれ所定のタイミングで駆動することによりサーフ アクタントアーム61を上昇させ、旋回させ、下降させ るようにしてチャンパ30外側の元の原点位置に移動さ せる (ステップSP40)。 続いてキヤタリストアーム 62 (図1及び図2) 用のエアーシリンダ75 (図3) 及び駆動モータがそれぞれ所定のタイミングで駆動する

させ、下降させる。これによりキヤタリストアーム62

の先端をレジストマスターガラス板7の外周部上方にまで移動させる(ステツプSP41)。

【0042】次いで薬液バルブ81D(図5)が駆動することにより当該キヤタリストアーム62のキヤタリストノズル93(図9(C))先端からキヤタリストを吐出させる(ステツブSP42)と共に、駆動モータが駆動することによりキヤタリストアーム62をレジストマ

12

スターガラス板7の外周部から中心部へ向けて移動させる(ステツプSP43)。これによりレジストマスターガラス板7に対してスピンコート法によるキヤタリストの塗布を行う。この後キヤタリストアーム62がレジス

トマスターガラス板7の中心部にまで移動すると、駆動 モータが停止し、かつ薬液バルブ81Dが閉じることに

モータが停止し、かつ楽被パルフ81Dが閉じることによりレジストマスターガラス板7に対するキヤタリストの塗布を停止する(ステツプSP44)。

【0043】続いて純水パルプ33E(図5)が開いてキヤタリストアーム62の純水ノズル92(図9(C))に対して純水を供給することにより当該純水ノンズル92の先端から純水を吐出させる。これによりレジストマスターガラス板7に対する水洗を開始する(ステップSP45)。この後所定時間が経過すると、純水パルプ33E(図5)が閉じることによりレジストマスターガラス板7の水洗を完了し(ステップSP46)、続いて薬液パルプ81D(図5)が開いてキヤタリストアーム62のキヤタリストノズル93(図9(C))に対してキヤタリストの供給を開始することによりレジストマスターガラス板7に対するキヤタリストの塗布を開始する(ステップSP47)。

【0044】この後所定時間が経過すると、薬液パルプ 81D(図5)が閉じることによりレジストマスターガ ラス板 7 に対するキヤタリストの塗布を完了し (ステツ プSP48)、続いて純水バルプ33Eが開くことによ りレジストマスターガラス板7の水洗を開始する (ステ ツプSP49)。さらにこのときキヤタリストアーム6 2の駆動モータが駆動することによりキヤタリストアー ム62をレジストマスターガラス板7の中心部から外周 部に向けて移動させ始め(ステツプSP50)、この後 キヤタリストアーム62がレジストマスターガラス板7 の外周部に到達すると、純水パルプ33E(図5)が閉 じることによりレジストマスターガラス板7に対する水 洗を停止する(ステツプSP51)。この後キヤタリス トアーム62用の駆動モータ及びエアーシリンダ75 (図3) がそれぞれ所定のタイミングで駆動してキヤタ リストアーム62を上昇させ、旋回させ、下降させるこ とによりこれを元の原点位置に戻す(ステツプSP5

62 (図1及び図2) 用のエアーシリンダ75 (図3) 【0045】続いてアクセレレータアーム63 (図1及び駆動モータがそれぞれ所定のタイミングで駆動する び図2) 用のエアーシリンダ74及び図示しないエアー ことにより、キヤタリストアーム62を上昇させ、旋回 50 シリンダがそれぞれ所定のタイミングで駆動してアクセ

レレータアーム63を上昇させ、旋回させ、下降させる ことにより当該アクセレレータアーム63をノズルの先 端がレジストマスターガラス板7の外周部上方に位置す るように移動させる(ステップSP53)。次いでアク セレレータアーム63用の切替えパルプ90B(図5) が駆動して純水側を選択すると共に、アクセレレータア ーム63用の純水パルプ33D(図5)が開くことによ りアクセレレータアーム63のノズル先端から純水を吐 出させ、かくしてレジストマスターガラス板7の水洗を 開始する(ステツプSP54)。

【0046】この際アクセレレータアーム63用の図示 しない上述のエアーシリンダが駆動することによりアク セレレータアーム63をレジストマスターガラス板7の 中心部に向けて旋回させる(ステップSP55)。この 後所定時間が経過してアクセレレータアーム 6 3 がレジ ストマスターガラス板7の中心部にまで移動すると、ア クセレレータアーム63用の純水パルプ33D(図5) が閉じてアクセレレータアーム63のノズルに対する純 水の供給を停止する(ステツプSP56)と共に、切替 えパルプ90B(図5)が駆動して薬液側を選択し、か 20 つ薬液パルプ81C(図5)が開いてアクセレレータア ーム63のノズルに対するアクセレレータの供給を開始 する。かくしてアクセレレータアーム63のノズル先端 からアクセレレータをレジストマスターガラス板7上に 吐出することにより、レジストマスターガラス板7に対 してスピンコート法によるアクセレレータの塗布を開始 する(ステップSP57)。

【0047】この後所定時間が経過すると、アクセレレ ータアーム63用の薬液パルプ81Cが閉じてアクセレ レータアーム63に対するアクセレレータの供給を停止 30 することによりアクセレレータの塗布が終了される(ス テツプSP58)。続いて切替えパルプ90Bが純水側 を選択し、かつ純水バルプ33D(図5)が開いてアク セレレータアーム63に対する純水の供給を開始するこ とによりアクセレレータアーム63のノズルから純水を 吐出してレジストマスターガラス板7に対する水洗を開 始する(ステツプSP59)。この後所定時間が経過す ると、純水パルプ33D(図5)が閉じてアクセレレー タアーム63に対する純水の供給を停止することにより レジストマスターガラス板7に対する水洗を停止し(ス 40 テツプSP60)、さらにこの後純水パルプ33D(図 5)が間欠的に開くことによりアクセレレータアーム6 3の先端から純水を間欠的に吐出する(ステツプSP6 1)。続いて次工程にレジストマスターガラス板7がな いことを確認すると(ステップSP62)、アクセレレ ータアーム63用の図示しない上述のエアーシリンダが 駆動することによりアクセレレータアーム63がレジス トマスターガラス板7の外周方向に移動を開始する(ス テツプSP63)。

トマスターガラス板7の外周部にまで到達すると、純水 バルブ33D(図5)が閉じることによりアクセレレー タアーム63のノズルに対する純水の供給を停止し(ス テツプSP64)、さらに純水パルプ33A(図5)が 閉じることによりチャンパ部30内の純水ノズル32に 対する純水の供給を停止した後(ステツプSP65)、 エアーシリンダ74(図5)と、アクセレレータアーム 63用の図示しない上述のエアーシリンダとがそれぞれ 所定のタイミングで駆動することにより、アクセレレー 10 タアーム 63 を上昇させ、旋回させ、下降させるように して元の原点位置に戻す(ステツプSP66)。さらに この後ターンテーブル駆動モータ20 (図3及び図4) が駆動し続けることにより当該ターンテーブル9上に吸 着固定されたレジストマスターガラス板7の水分を振り 切るようにして除去し(ステップSP67)、この後所 定時間が経過するとターンテーブル駆動モータ20が停 止することによりレジストマスターガラス板7の回転を 停止させる(ステツプSP68)。

14

【0049】さらに第1の枠体2Aのシヤツタ3が開き (ステップSP69)、次いでトランスフアユニット1 1 (図1及び図2) が駆動してターンテーブル9上のレ ジストマスターガラス板7上方にまで移動した後当該レ ジストマスターガラス板?をクランプし(ステツプSP 70)、この後ターンテーブル9への吸着固定が停止さ れる(ステツプSP71)。さらにトランスフアユニツ ト11がレジストマスターガラス板7を続く工程ライン に送り(ステツプSP72)、この後第1の枠体2Aの シヤツタ3が閉じ(ステツプSP73)た後ステツプS P74に進んでこのNED前処理手順RT2を終了す る。

【0050】(3) 実施例の動作

以上の構成において、このデイスク原盤作成装置1で は、第1の枠体2A内部のガラスステージ8上に供給さ れた加工対象のレジストマスターガラス板7に対して、 まず水洗を行うことによりその表面に付着した帯電した ほこりを除去し(ステツプSP1~SP12)、次いで モニタ用レーザ光発射部110及びフオトデイテクタ3 1でなる現像モニタで監視を行いながら当該レジストマ スターガラス板7を現像した後(ステップSP13~S P16)、水洗 (ステツプSP17及びSP18) する ようにして現像処理を行う。

【0051】またこの後当該レジストマスターガラス板 7を水洗し(ステツプSP30~SP34)、サーフア クタントを塗布する(ステップSP35及びSP36) ことによりレジスト表面のぬれ性を向上させ、この後水 洗する (ステップSP37~SP40) ようにして過剰 なサーフアクタントをレジストマスターガラス板7上面 から除去し、キヤタリストを塗布し (ステツプSP41 ~SР52)、アクセレレータを塗布し(ステツプSP 【0048】次いでアクセレレータアーム63がレジス 50 53~SP66)、当該レジストマスターガラス板7か

できる。

ら過剰な薬液及び水洗水を除去する(ステツプSP67 ~SP68) ようにしてNED前処理を行う。

【0052】この場合このデイスク原盤作成装置1で は、これら一連の処理がすべて1つのチヤンバ30内に おいて行われ、アルカリ性の現像液や、酸性のサーフア クタント及びキヤタリスト等の薬液及び水洗水がすべて チャンパ30内側の底部に設けられた1つの排水孔37 (図1及び図2)を介して筐体2外部の排水中和槽41 (図8) に排出される。従つて、例えば従来のように現 像装置及びNED前処理装置が別体に構成されている場 10 合に比べて排液の中和処理を容易に行うことができる。 また現像処理及びNED前処理が1つのチャンバ30内 において行われるため、NED前処理工程時(RT2) に酸性のキヤタリストがチャンパ30の内壁に付着した 場合においても、現像処理工程時(RT1)におけるア ルカリ性の現像液がチャンパ内壁に付着するなどして中 和されることにより当該チャンパ30の内壁の汚染を防 止することができる。

【0053】従つてNED前処理工程時(RT2)にお から飛び跳ねたキヤタリストがチャンパ30の内壁にお いて跳ね返り、レジストマスターガラス板7上に付着す ることにより発生するしみ不良やピンホール状のメッキ 不析出不良を未然に防止することができる。実際上実験 によれば、上述のようなデイスク原盤作成装置1を用い て上述のような現像処理手順RT1及びNED前処理手 順RT2に従つてレジストマスターガラス板7に対する 現像処理及びNED前処理を行つた後、所定のNED処 理を行つたところ、欠陥のない均一なニツケル皮膜を得 られることが確認できた。

【0054】またこの後これらNED処理の施されたガ ラス板を用いてスタンパを作成し、当該スタンパを用い て光デイスクを成形して信号特性及び欠陥評価検査を行 つた場合においても、図18及び図19に示すように良 好な結果を得ることができた。さらにレジストマスター ガラス板7を連続的に順次投入するようにした場合にお いても、チャンパ30の内部におけるキャタリストの廃 液による汚染が認められず、現像液及びアクセレレータ の併用によりチャンパ30内部から流出した排液のPH値 測定では、PH7.5 ~7.8 の範囲内にあり、ほぼ中和処理 40 が同時に行い得る効果を得ることができた。

【0055】(4)実施例の効果

以上の構成によれば、1つのチャンパ30内部に回転自 在に軸支されたターンテーブル9を設けると共に、当該 チャンパ30外側に必要に応じて現像液及び純水を吐出 し得る現像アーム60と、サーフアクタント及び純水を 吐出し得るサーフアクタントアーム61と、キヤタリス ト及び純水を吐出し得るキヤタリストアーム62と、ア クセレレータ及び純水を吐出し得るアクセレレータアー ム63とをそれぞれ設け、ターンテーブル9上に吸着固 50 ジストマスタ板に対する現像処理工程と、レジストマス

定された加工対象のレジストマスターガラス板7に対し てこれら各現像アーム60、サーフアクタントアーム6 1、キヤタリストアーム62及びアクセレレータアーム 63をそれぞれ介して所定のタイミングで現像液及び純 水、サーフアクタント及び純水、キヤタリスト及び純水 並びにアクセレレータ及び純水を順次供給するようにし て現像及びNED前処理を行うようにしたことにより、 廃水処理槽での中和処理が省けると共にチャンパ30内 壁の汚染に起因するレジストマスターガラス板7の不良 発生を未然に防止し得、かくして効率良くスタンパを作 成でき、かつ歩留りの良いデイスク原盤作成装置を実現

16

【0056】またレジストマスターガラス板7に対する 現像処理及びNED前処理を1つの装置内において行う ことができるため、現像処理工程からNED前処理工程 までのレジストマスターガラス板7の移動にかかる時間 を必要としない分、現像処理工程からNED前処理工程 までの時間短縮を図れると共に、現像装置及びNED前 処理装置が一体化された分、マスタリング工程に必要な いてターンテーブル9上のレジストマスターガラス板7 20 各装置の設置スペースの有効化とコストダウンとクリー ンルームレスとが図れる利点もある。

【0057】(5)他の実施例

なお上述の実施例においては、ターンテーブル9上に吸 着固定された加工対象のレジストマスターガラス板7に 対して現像液、サーフアクタント、キヤタリスト又はア クセレレータを供給するためのアーム60、61、6 2、63をそれぞれ個別にチャンパ30の外部に設ける ようにした場合について述べたが、本発明はこれに限ら ず、1つのアーム又はノズル等の現像液及び薬液を吐出 30 し得る手段によつて現像液、サーフアクタント、キヤタ リスト又はアクセレレータを供給し得るようにしても良

【0058】また上述の実施例においては、レジストマ スターガラス板7を固定保持して回転させる回転駆動手 段としてターンテーブル9を用いるようにした場合につ いて述べたが、本発明はこれに限らず、レジストマスタ ーガラス板7を固定保持して回転させる回転駆動手段と してはこの他種々の回転駆動手段を適用することができ る。

【0059】さらに上述の実施例においては、ターンテ ーブル9上のレジストマスターガラス板7から飛び散つ た現像液、キヤタリスト等の薬液及び水洗水が筐体2内 部に飛散するのを防止する飛散防止手段として3重構造 のチャンパ30を適用するようにした場合について述べ たが、本発明はこれに限らず、飛散防止手段としては、 この他種々のものを適用できる。

[0060]

【発明の効果】上述のように本発明によれば、デイスク 成形時に金型となるデイスク原盤の作成工程のうち、レ 夕板の表面を導体化させるための前処理工程とを同じ飛散防止手段の内部において行うようにしたことにより、現像処理工程時に生じる現像液でなる強アルカリ性の廃液と、レジストマスタ板の表面を導体化させるための前処理工程時に生じる薬液でなる酸性の廃液とが中和させることができる。従つて現像処理工程時及びレジストマスタ板の表面を導体化させるための前処理工程時に生じる廃液を効率良く処理できると共に、飛散防止手段の内壁面の汚染を防止でき、かくして効率良くかつ歩留り良くデイスク原盤を作成し得るようにすることのできるデ 10 イスク原盤作成装置を実現できる。

【図面の簡単な説明】

【図1】実施例によるデイスク原盤作成装置の全体構成 を示す略線的な上面図である。

【図2】第1の枠体内部の様子を示す上面図である。

【図3】第1の枠体内部の様子を示す側面図である。

【図4】トランスフアユニツトによるレジストマスター ガラス板の搬送の様子を示す側面図である。

【図5】デイスク原盤作成装置の配管の様子を示す略線 的な側面図である。

【図6】 筐体の背面の様子を示す背面図である。

【図7】デイスク原盤作成装置の配管の様子を示す側面 図である。

【図8】デイスク原盤作成装置の排水ラインを部分的に 断面をとつて示す側面図である。

【図9】各アームの先端の様子を部分的に断面をとつて示す側面図である。

【図10】モニタ用レーザ光発射部の構成を部分的に断面をとつて示す側面図である。

18

【図11】現像処理手順を示すフローチヤートである。

【図12】現像処理手順を示すフローチヤートである。

【図13】NED前処理手順を示すフローチヤートであ ろ

【図14】NED前処理手順を示すフローチヤートである。

【図15】NED前処理手順を示すフローチヤートである。

【図16】NED前処理手順を示すフローチヤートである。

【図17】NED前処理手順を示すフローチヤートである。

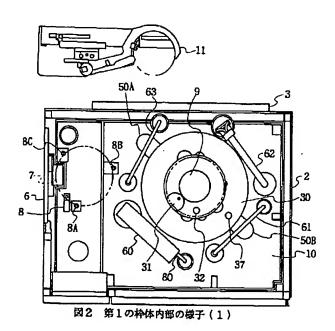
【図18】図1のデイスク原盤作成装置を用いて形成したスタンパの信号特性の実験結果を示す表である。

【図19】図1のデイスク原盤作成装置を用いて形成したスタンパの信号特性の実験結果を示す表である。

【符号の説明】

20 1 ……デイスク原盤作成装置、7 ……レジストマスターガラス板、9 ……ターンテーブル、20 ……ターンテーブル駆動モータ、30 ……チャンバ、32 ……排液孔、60 ……現像アーム、61 ……サーフアクタントアーム、62 ……キャタリストアーム、63 ……アクセレレータアーム、RT1 ……現像処理手順、RT2 ……NED前処理手順。





【図4】

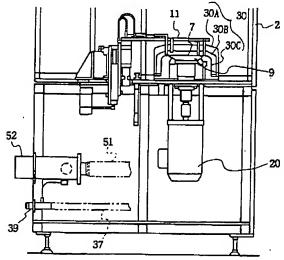
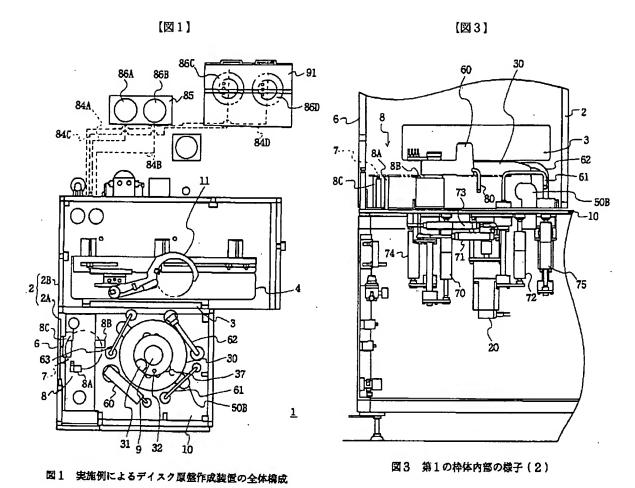


図4 トランスフアユニットによる レジストマスタガラス板の搬送の様子



9ÓB

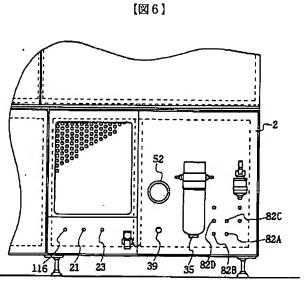


図6 筐体の背面の様子

図5 デイスク原盤作成装置の配管の様子

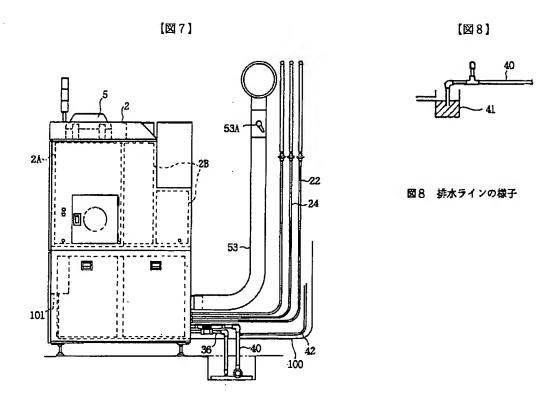
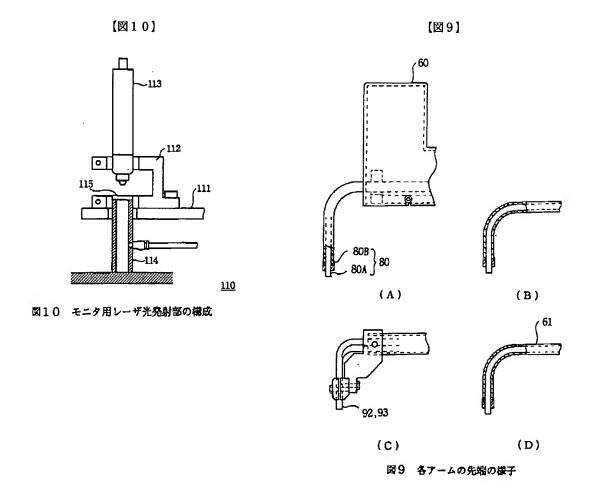


図7 デイスク原盤作成装置の配管



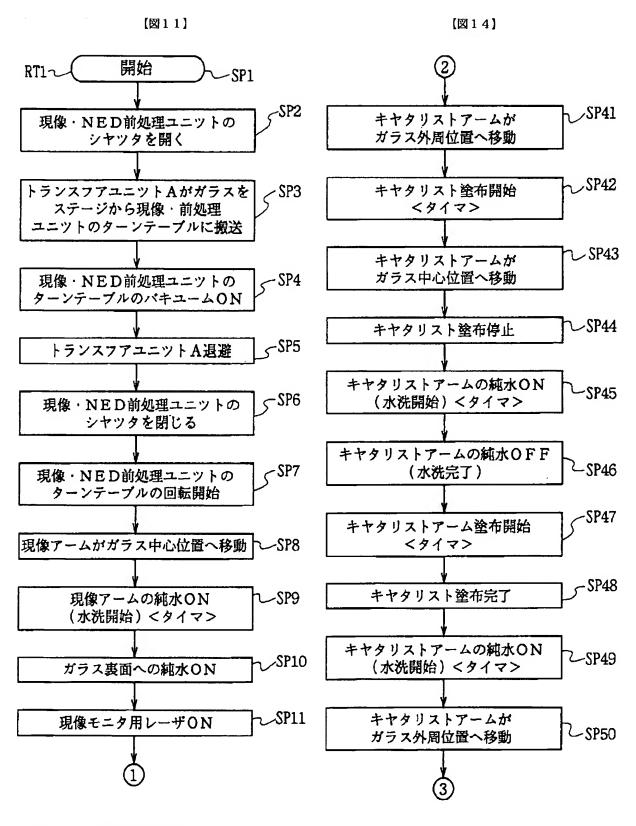
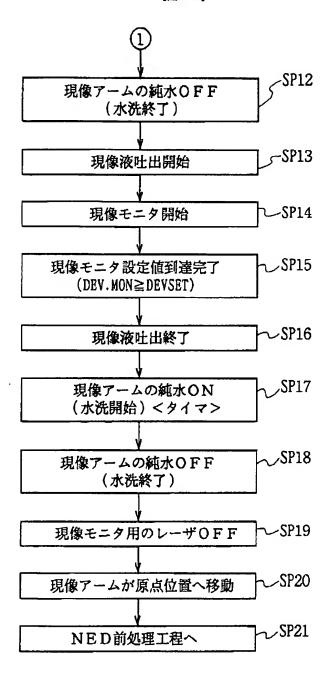


図11 現像処理手順(1)

図14 NED処理手順(2)

【図12】



[図18]

外観検査	Push-Pull Data											
NED判定	Start	End	1	center 2	3							
合格	0.054	0.053	0.054	0.054	0.054							
	0.052	0.053	0.052	0.054	0.054							
	0.057	0.056	0.056	0.055	0.055							
•	0.052	0.052	0.051	0.051	0.050							
	0.052	0.053	0.053	0.053	0.053							
•	0.062	0.050	0.051	0.051	0.052							
	0-054	0.051	0.052	0.053	0.053							
	0.053	0.052	0.052	0.052	0.052							
,	0.054	0.053	0.053	0.053	0.054							
,	0.052	0.049	0.051	0.052	0.052							
,	0.053	0.051	0.052	0.052	0.052							
,	0.056	0.055	0.054	0.054	0.065							
	0.056	0.052	0.054	0.054	0.054							
	0.057	0.054	0.055	0.053	0.055							
,	0.056	0.055	0.054	0.054	0.054							
•	0.054	0.051	0.053	0.053	0.053							
•	0.052	0.051	0.051	0.051	0.051							
•	0.055	0.054	0.054	0.054	0.055							
•	0.057	0.057	0.056	0.056	0.056							
•	0.056	0.056	0.055	0.056	0.056							
•	0.051	0.050	0.052	0.052	0.052							
	0.056	0.055	0.056	0.055	0.056							
•	0.057	0.056	0.056	0.056	0.055							
	0.056	0.054	0.055	0.065	0.054							
	0.059	0.061	0.069	0.059	0.059							
•	0.054	0.052	0.053	0.053	0.053							

図18 実験結果

図12 現像処理手順(2)



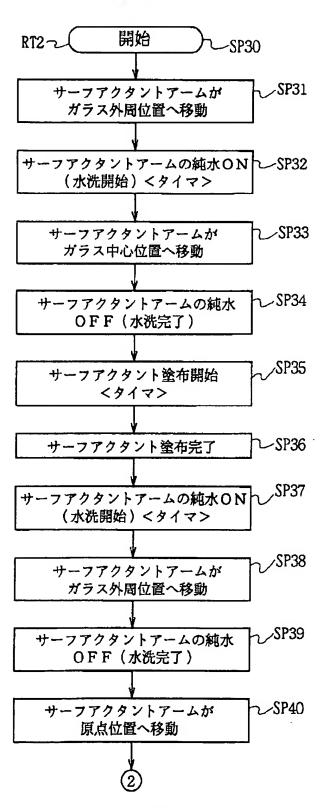


図13 NED処理手順(1)

【図15】

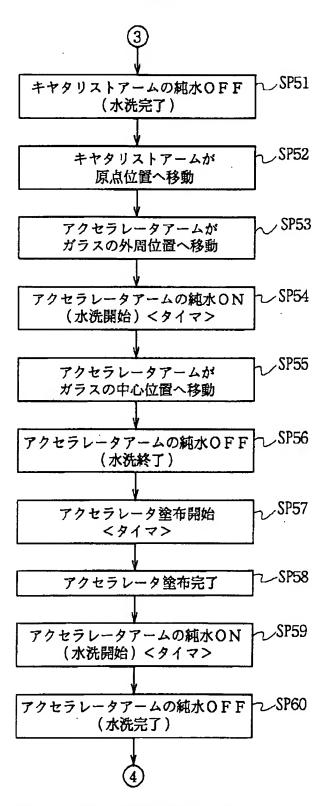


図15 NED処理手順(3)



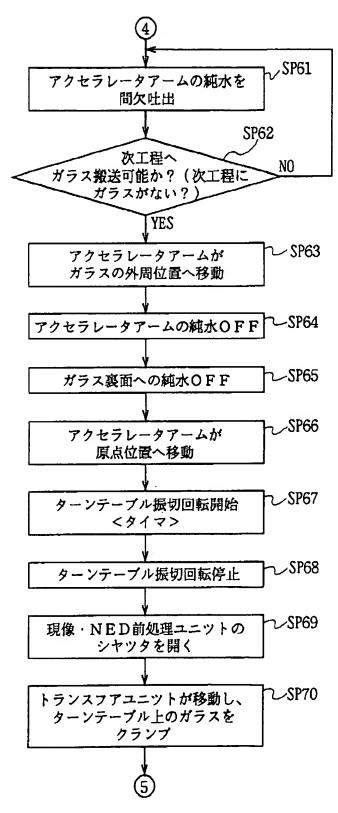


図16 NED処理手順(4)

【図17】

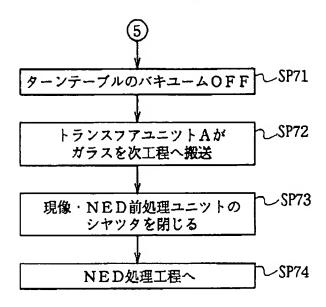


図17 NED処理手順(5)

【図19】

Γ		Г	Π	Γ	Γ	Γ								Γ	Γ		Ī	Γ						Ī					
Cross Talk	AVB	0.280	0.267	0.270	0.350	0.210	0.287	0.350	0.267	0.287	0.270	0.350	0.307	0.287		0.263	0.307	0.357	0.230		0.280	0.323	0.353	0.237	0.270	0.270	0.337	0.370	0.287
	옯	0.280	0.270	0.270	0.360	0.260	0.300	0.360	0.270	0.230	0.280	0.360	0.320	0.300		0.270	0.320	0.370	0.300		0.230	0.330	0.380	0.300	0.280	0.280	0.350	0.370	0.300
	CENTER	0.280	0.260	0.270	0.350	0.260	0.230	0.350	0.270	0.230	0.270	0.350	0.310	0.230		0.260	0.310	0.360	0.230		0.280	0.320	0.350	0.300	0.270	0.270	0.350	0.370	0.230
	START	0.280	0.270	0.270	0.340	0.230	0.2.0	0.340	0.280	0.280	0.260	0.340	0.230	0.370		0.260	0.230	0.340	0.280		0.270	0.320	0.350	0.230	0.260	0.260	0.310	0.370	0.270
	AVE	0.497	0.421	0.407	0.399	0.416	0.394	0.403	0.416	0.501	0.412	0.339	0.403	0.506		0.403	0.30	0.394	0.493		0.416	0.412	0.399	0.484	0.407	0.416	0.394	0.339	0.385
ag.	23	0.497	0.416	0.403	0.403	0.416	0.403	0.416	0.416	0.497	0.416	0.403	0.403	0.510		0.403	0.330	0.403	0.497		0.416	0.416	0.390	0.484	0.416	0.430	0.340	0.403	0.330
13/1T0P	CENTER	0.497	0.430	0.403	0.403	0.416	0.390	0.403	914.0	0.497	0.416	0.330	0.403	0.510		0.403	0.330	0.403	0.497		0.416	0.416	0.403	0.484	0.403	0.416	0.390	0.403	0.330
	START	0.497	0.416	0.416	0.330	0.416	0.330	0.330	0.416	0.510	0.403	0.403	0.403	0.497		0.403	0.403	0.376	0.484		0.416	0.403	0.403	0.484	0:403	0.403	0.403	0.330	0.376
	AVB	0.747	0.741	0.730	0.736	0.747	0.730	0.730	0.747	0.741	0.753	0.730	0.719	0.741		0.730	0.714	0.714	0.741	•	0.725	0.719	0.714	0.730	0.725	0.736	0.708	0.708	0.725
TOP	EKD	0.747	0.730	0.730	0.730	0.747	0.730	0.730	0.747	0.730	0.747	0.730	0.714	0.747		0.730	0.714	0.697	0.730		0.714	0.714	0.714	0.730	0.714	0.730	0.637	0.697	0.714
111/110	CENTER	0.747	0.747	0.730	0.730	0.747	0.730	0.730	0.747	0.747	0.747	0.730	0.714	0.730		0.730	0.714	0.714	0.747		0.730	0.714	0.714	0.730	0.730	0.747	0.714	0.714	0.730
	START	0.747	0.747	0.730	0.747	0.747	0.730	0.730	0.747	0.747	0.764	0.730	0.730	0.747		0.730	0.714	0.730	0.747		0.730	0.730	0.714	0.730	0.730	0.730	0.714	0.714	0.730
C1 (PEAK)		ន	z	18	17	Z	14	ಹ	8	ß	81	æ	Z	82		21.	16	ĸ	18		. 93	15	22	14	ធ	22	21	91	8
CI (AVE)		С	1		٥	1	0	1	1	0	0	0	0	0		1	0	1	1		0	0	0	0	0	-	-	0	-

図19 実験結果

【手続補正書】

【提出日】平成7年4月25日

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】図面の簡単な説明

【補正方法】変更

【補正内容】

【図面の簡単な説明】

【図1】実施例によるデイスク原盤作成装置の全体構成 を示す略線的な上面図である。

【図2】第1の枠体内部の様子を示す上面図である。

【図3】第1の枠体内部の様子を示す側面図である。

【図4】トランスフアユニツトによるレジストマスター ガラス板の搬送の様子を示す側面図である。

【図 5】デイスク原盤作成装置の配管の様子を示す略線的な側面図である。

【図6】 筐体の背面の様子を示す背面図である。

【図7】デイスク原盤作成装置の配管の様子を示す側面 図である。

【図8】デイスク原盤作成装置の排水ラインを部分的に 断面をとつて示す側面図である。

【図9】各アームの先端の様子を部分的に断面をとつて示す側面図である。

【図10】モニタ用レーザ光発射部の構成を部分的に断面をとつて示す側面図である。

【図11】現像処理手順を示すフローチヤートである。

【図12】現像処理手順を示すフローチヤートである。

【図13】NED前処理手順を示すフローチヤートである。

【図14】NED前処理手順を示すフローチヤートである。

【図15】NED前処理手順を示すフローチヤートであ る。

【図16】NED前処理手順を示すフローチヤートである。

【図17】NED前処理手順を示すフローチヤートであ

【図18】図1のデイスク原盤作成装置を用いて形成したスタンパの信号特性の実験結果を示す図表である。

【図19】図1のデイスク原盤作成装置を用いて形成したスタンパの信号特性の実験結果を示す図表である。

【符号の説明】

1……デイスク原盤作成装置、7……レジストマスターガラス板、9……ターンテーブル、20……ターンテーブル駆動モータ、30……チャンパ、32……排液孔、60……現像アーム、61……サーフアクタントアーム、62……キャタリストアーム、63……アクセレレータアーム、RT1……現像処理手順、RT2……NED前処理手順。

フロントページの続き

(72)発明者 三津井 教夫

東京都品川区北品川6丁目7番35号ソニー株式会社内